### МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО

**УТВЕРЖДАЮ** 

Зав. выпускающей кафедры

### Интеллектуальные датчики

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Микро- и наноэлектроники

Учебный план Лицензирование 03.03.01 25 00.plx

03.03.01 Прикладные математика и физика

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		И	гого
Недель	1	6		
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ
Лекции	32	32	32	32
Лабораторные	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Иная контактная работа	0,35	0,35	0,35	0,35
Консультирование перед экзаменом и практикой	2	2	2	2
Итого ауд.	66,35	66,35	66,35	66,35
Контактная работа	66,35	66,35	66,35	66,35
Сам. работа	33	33	33	33
Часы на контроль	44,65	44,65	44,65	44,65
Итого	144	144	144	144

г. Рязань

### Программу составил(и):

к.т.н., доц., Вишняков Николай Владимирович

Рабочая программа дисциплины

### Интеллектуальные датчики

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 03.03.01 Прикладные математика и физика (приказ Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 890)

составлена на основании учебного плана:

03.03.01 Прикладные математика и физика

утвержденного учёным советом вуза от 30.05.2025 протокол № 13.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

### Микро- и наноэлектроники

Протокол от 03.06.2025 г. № 8 Срок действия программы: 2025 - 2029 уч.г. Зав. кафедрой Литвинов Владимир Георгиевич

## Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена исполнения в 2026-2027 учебном Микро- и наноэлектроники				
	Протокол от	2026 г.	<b>№</b>	
	Зав. кафедрой			
	Визирование РПД для испол	лнения	в очередном учебном	году
Рабочая программа пересмотрена исполнения в 2027-2028 учебном Микро- и наноэлектроники				
	Протокол от	2027 г.	№	
	Зав. кафедрой			
	Визирование РПД для испо	лнения	в очередном учебном	году
Рабочая программа пересмотрена исполнения в 2028-2029 учебном Микро- и наноэлектроники				
	Протокол от	2028 г.	№	
	Зав. кафедрой			
	Визирование РПД для испо	лнения	в очередном учебном	году
Рабочая программа пересмотрена исполнения в 2029-2030 учебном				
Микро- и наноэлектроники				
	Протокол от	2029 г.	№	
	Зав. кафедрой			

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)					
1.1	Целью освоения дисциплины является формирование базовых знаний и умений в области общих физических принципов преобразования информации, классификации твердотельных датчиков, принципов работы, устройства и способов применения их в технических системах, согласования их с измерительной цепью в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом; формирование у студентов способности к логическому мышлению, анализу и восприятию информации посредством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.					
1.2	Задачи:					
1.3	- расширение научного кругозора и эрудиции в вопросах преобразования измеряемой физической величины в электрический информационный сигнал;					
1.4	- обучение представлениям о различных классах твердотельных датчиков, принципах работы, устройстве и способах применения их в технических системах;					
1.5	- обучение представлениям о метрологии датчиков, согласования их с измерительной цепью;					
1.6	- обучение навыкам исследовательской и инженерной работы;					
1.7	- обучение методам обработки и анализа результатов лабораторных экспериментов.					

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ					
I	<b>Д</b> икл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.03				
2.1	Требования к предвари	тельной подготовке обучающегося:				
2.1.1	Схемотехника микроэлег	Схемотехника микроэлектронных устройств				
2.1.2	Тепловые процессы в эле	ектронике				
2.1.3	Элементы электронной т	ехники				
2.1.4	Информационные техно.	логии				
2.1.5	Твердотельная электроні	нка				
2.1.6	Цифровая обработка сиг	налов в электронных устройствах				
2.1.7	Технологические процес	сы наноэлектроники				
2.1.8	Схемотехника микрэлект	громеханических устройств				
2.2	2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как					
		input in a constant in a const				
	предшествующее:					
2.2.1	предшествующее:	пускной квалификационной работы				
2.2.1	предшествующее:	пускной квалификационной работы				
2.2.1 2.2.2	предшествующее: Выполнение и защита вы	пускной квалификационной работы роводники				
2.2.1 2.2.2 2.2.3	предшествующее: Выполнение и защита вы Неупорядоченные полуп	пускной квалификационной работы роводники говая оптика				
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4	предшествующее: Выполнение и защита вы Неупорядоченные полуп Оптоэлектроника и кван	ппускной квалификационной работы роводники говая оптика пектронных устройств				
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5	предшествующее: Выполнение и защита вы Неупорядоченные полуп Оптоэлектроника и кван Функциональные узлы э.	пускной квалификационной работы роводники говая оптика пектронных устройств				
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5	предшествующее: Выполнение и защита вы Неупорядоченные полуп Оптоэлектроника и кван Функциональные узлы э. Преддипломная практик Производственная практ	ппускной квалификационной работы роводники говая оптика пектронных устройств				
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7	предшествующее: Выполнение и защита вы Неупорядоченные полуп Оптоэлектроника и кван Функциональные узлы э. Преддипломная практик Производственная практ	ппускной квалификационной работы роводники говая оптика пектронных устройств а ика ика				

### 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен строить физические и математические модели приборов, схем, устройств, измерительных и технологических установок электроники и наноэлектроники, использовать стандартные программные средства, изучать стандарты, проводить анализ результатов

ПК-1.1. Проводит моделирование и исследования функциональных, статических, динамических, временных, частотных характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

#### Знать

принципы схемотехнического моделирования и исследования характеристик электронных приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

### Уметь

строить физические и математические модели электронных приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

#### Владеть

навыками компьютерного моделирования электронных приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

ПК-5: Способен тестировать и испытывать готовые изделия "система в корпусе" на соответствие	е требованиям
технического задания, измерять и испытывать изделия "система в корпусе"	

ПК-5.1. Проводит предварительные измерения опытных образцов изделий "система в корпусе"

Знать

Уметь

Владеть

ПК-5.2. Обрабатывает результаты измерений и испытаний опытных образцов изделий "система в корпусе"

Знать

Уметь

Владеть

### В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основные физические явления; основные факты, базовые концепции и модели физики твердого тела, основные характеристики материалов, их применение в элементах электроники и наноэлектроники, основы современных технологий микро- и наноэлектроники.
3.2	Уметь:
3.2.1	применять на практике основные приемы и программные средства обработки и представления экспериментальных данных.
3.3	Владеть:
3.3.1	работы с измерительными приборами; грамотным физическим научным языком; международной системой единиц измерений физических величин (СИ) при физических расчетах и формулировке физических закономерностей.

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)					
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- ции	Литература	Форма контроля
	Раздел 1. Введение. Общие принципы построения интеллектуальных измерительных преобразователей.					
1.1	Введение. Общие принципы построения интеллектуальных измерительных преобразователей. /Тема/	7	0			Аналитический отчёт. Экзамен.
1.2	Введение. Общие принципы построения интеллектуальных измерительных преобразователей. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
1.3	Введение. Общие принципы построения интеллектуальных измерительных преобразователей. /Ср/	7	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.
	Раздел 2. Метрологические характеристики интеллектуальных датчиков в статическом и динамическом режимах.					
2.1	Метрологические характеристики интеллектуальных датчиков в статическом и динамическом режимах. /Тема/	7	0			Аналитический отчёт. Экзамен.

2.2	Метрологические характеристики интеллектуальных датчиков в статическом и динамическом режимах. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	Экзамен.
2.3	Датчики магнитного поля. Датчики холла. /Лаб/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
2.4	Метрологические характеристики интеллектуальных датчиков в статическом и динамическом режимах. /Пр/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
2.5	Метрологические характеристики интеллектуальных датчиков в статическом и динамическом режимах. /Ср/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	Аналитический отчёт. Экзамен.
	Раздел 3. Формирование сигналов пассивных датчиков.					
3.1	Формирование сигналов пассивных датчиков. /Тема/	7	0			Аналитический отчёт. Экзамен.
3.2	Формирование сигналов пассивных датчиков. Потенциометрические схемы включения пассивных датчиков. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
3.3	Формирование сигналов пассивных датчиков. Мостовые схемы включения пассивных датчиков. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.

3.4	Интегральные датчики температуры. /Лаб/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
3.5	Формирование сигналов пассивных датчиков. /Пр/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	Контрольная работа.
3.6	Формирование сигналов пассивных датчиков. /Ср/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.
	Раздел 4. Формирование сигналов активных датчиков.					
4.1	Формирование сигналов активных датчиков. /Тема/	7	0			Аналитический отчёт. Экзамен.
4.2	Формирование сигналов активных датчиков. Датчик-генератор тока, напряжения, заряда. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
4.3	Формирование сигналов активных датчиков. Согласование датчика с измерительной схемой. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
4.4	Пороговые датчики температуры. /Лаб/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.

	_		ī	ī		
4.5	Формирование сигналов активных датчиков. /Пр/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
4.6	Формирование сигналов активных датчиков. /Cp/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.
	Раздел 5. Усиление измерительного сигнала.					
5.1	Усиление измерительного сигнала. /Тема/	7	0			Аналитический отчёт. Экзамен.
5.2	Усиление измерительного сигнала. Измерительные усилители на ОУ. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
5.3	Усиление измерительного сигнала. Коррекция аддитивной погрешности и гальваническая развязка в измерительных усилителях. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
5.4	Резистивные и гальванические термодатчики. /Лаб/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
5.5	Усиление измерительного сигнала. /Пр/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.

5.6	Усиление измерительного сигнала. /Ср/	7	6	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.
	Раздел 6. Вторичные функциональные преобразователи.					
6.1	Вторичные функциональные преобразователи. /Тема/	7	0			Аналитический отчёт. Экзамен.
6.2	Вторичные функциональные преобразователи. Преобразователи ток — напряжение, напряжение — ток. Интеграторы и дифференциаторы. Усилители — преобразователи заряда. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
6.3	Вторичные функциональные преобразователи. Логарифмирующие и экспоненциальные преобразователи. Сумматоры и вычитатели. Перемножители. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
6.4	Вторичные функциональные преобразователи. /Пр/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
6.5	Вторичные функциональные преобразователи. /Ср/	7	5	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.
	Раздел 7. Функциональные преобразователи на основе ЦАП и АЦП.					
7.1	Функциональные преобразователи на основе ЦАП и АЦП. /Тема/	7	0			Аналитический отчёт. Экзамен.
7.2	Функциональные преобразователи на основе ЦАП. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.

7.3	Функциональные преобразователи на основе АЦП. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
7.4	Функциональные преобразователи на основе ЦАП и АЦП. /Пр/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
7.5	Функциональные преобразователи на основе ЦАП и АЦП. /Ср/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.
	Раздел 8. Высокоинтеллектуальные датчики.					
8.1	Высокоинтеллектуальные датчики. /Тема/	7	0			Аналитический отчёт. Экзамен.
8.2	Высокоинтеллектуальные датчики. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
8.3	Сопряжение датчика с микроконтроллером. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
8.4	Высокоинтеллектуальные датчики. /Пр/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.

8.5	Высокоинтеллектуальные датчики. /Ср/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.
	Раздел 9. Применение современных интеллектуальных датчиков в технических и биотехнических системах.					
9.1	Применение современных интеллектуальных датчиков в технических и биотехнических системах. /Тема/	7	0			Аналитический отчёт. Экзамен.
9.2	Применение современных интеллектуальных датчиков в технических и биотехнических системах. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
9.3	Применение современных интеллектуальных датчиков в технических и биотехнических системах. /Пр/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
9.4	Применение современных интеллектуальных датчиков в технических и биотехнических системах. /Ср/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.
	Раздел 10. Заключение. Тенденции развития современных твердотельных датчиков.					
10.1	Заключение. Тенденции развития интеллектуальных датчиков. /Тема/	7	0			Аналитический отчёт. Экзамен.
10.2	Заключение. Тенденции развития интеллектуальных датчиков. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
10.3	Заключение. Тенденции развития интеллектуальных датчиков. /Ср/	7	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.

	Раздел 11. Промежуточная аттестация.				
11.1	Подготовка к аттестации, иная контактная работа. /Тема/	7	0		
11.2	Подготовка к экзамену. /Экзамен/	7	44,65	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Контрольные вопросы.
11.3	Консультация перед экзаменом. /Кнс/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	
11.4	Приём экзамена. /ИКР/	7	0,35	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Контрольные вопросы.

### 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Оценочные материалы по дисциплине "Интеллектуальные датчики"").

		6.1. Рекомендуемая литература				
	6.1.1. Основная литература					
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС		
Л1.1	Еремина И. Н., Саноян А. Г.	Физико-технические основы микро- и наноустройств : учебное пособие	Самара: РЕАВИЗ, 2010, 60 с.	2227-8397, http://www.ipr bookshop.ru/1 0148.html		
Л1.2	Шарапов В. М., Полищук Е. С., Кошевой Н. Д., Ишанин Г. Г., Минаев И. Г., Совлуков А. С., Шарапов В. М., Полищук В. С.	Датчики : справочное пособие	Москва: Техносфера, 2012, 624 с.	978-5-94836- 316-5, http://www.ipr bookshop.ru/1 6974.html		
Л1.3	Марукович Е. И., Марков А. П., Сергеев С. С., Марукович Е. И.	Бесконтактная термометрия	Минск: Белорусская наука, 2014, 252 с.	978-985-08- 1681-8, http://www.ipr bookshop.ru/2 9421.html		
Л1.4	Гольдштейн А. Е.	Физические основы получения информации : учебник	Томск: Томский политехническ ий университет, 2010, 292 с.	978-5-98298- 650-4, http://www.ipr bookshop.ru/3 4730.html		
Л1.5	Шишкин Г.Г., Агеев И.М.	Наноэлектроника. Элементы, приборы, устройства : учеб. пособие	М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011, 408c.	978-5-9963- 0638-1, 1		

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Количество/
312	льторы, составители	Sai habre	год	название ЭБС
Л1.6	Войтович, И. Д., Корсунский, В. М.	Интеллектуальные сенсоры : учебное пособие	Москва: Интернет- Университет Информационн ых Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2024, 1163 с.	978-5-4497- 2399-4, https://www.ip rbookshop.ru/ 133940.html
		6.1.2. Дополнительная литература	•	
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л2.1	Богуш М. В., Панич А. Е.	Проектирование пьезоэлектрических датчиков на основе пространственных электротермоупругих моделей	Москва: Техносфера, 2014, 324 с.	978-5-94836- 371-4, http://www.ipr bookshop.ru/3 1872.html
Л2.2	Шарапов В. М., Минаев И. Г., Сотула Ж. В., Куницкая Л. Г., Шарапов В. М.	Электроакустические преобразователи	Москва: Техносфера, 2013, 296 с.	978-5-94836- 357-8, http://www.ipr bookshop.ru/3 1881.html
Л2.3	Шебалкова Л. В., Легкий В. Н., Ромодин В. Б., Легкий В. Н.	Микроволновые и ультразвуковые сенсоры : учебное пособие	Новосибирск: Новосибирский государственн ый технический университет, 2015, 172 с.	978-5-7782- 2586-2, http://www.ipr bookshop.ru/4 5108.html
Л2.4	Архипов А. М., Иванов В. С., Панфилов Д. И.	Датчики Freescale Semiconductor	Москва: ДМК Пресс, 2010, 184 с.	978-5-94120- 204-1, http://e.lanboo k.com/books/e lement.php? pl1_id=60998
		6.1.3. Методические разработки		
№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л3.1	Капуткин Д. Е., Шустиков А. Г., Ашмарин Г. М.	Физика. Обработка результатов измерений при выполнении лабораторных работ : учебно-методическое пособие	Москва: Издательский Дом МИСиС, 2007, 107 с.	2227-8397, http://www.ipr bookshop.ru/5 6598.html
Л3.2	Вишняков Н.В., Гудзев В.В., Ермачихин А.В., Рыбин Н.Б., Толкач Н.М.	Современные твердотельные датчики. Датчики магнитного поля. Датчики Холла: Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2016,	https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/1286
Л3.3	Вишняков Н.В., Гудзев В.В., Ермачихин А.В., Рыбин Н.Б., Толкач Н.М.	Современные твердотельные датчики. Интегральные датчики температуры : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2016,	https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/1287
Л3.4	Вишняков Н.В., Гудзев В.В., Ермачихин А.В., Рыбин Н.Б., Толкач Н.М.	Современные твердотельные датчики. Пороговые датчики температуры : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2016,	https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/1288

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС			
Л3.5	Вишняков Н.В., Гудзев В.В., Ермачихин А.В., Рыбин Н.Б., Толкач Н.М.	Современные твердотельные датчики. Резистивные и гальванические термодатчики : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2016,	, https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/1289			
	6.2. Переч	ень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "I	Інтернет"	•			
Э1	Сайт кафедры микро- и	наноэлектроники РГРТУ: http://www.rsreu.ru/faculties/fe/kafedri/r	nnel				
Э2	Система дистанционног	го обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа: по паролю: http	://cdo.rsreu.ru/				
Э3	Единое окно доступа к	образовательным ресурсам, режим доступа: по паролю: http://wind	ow.edu.ru/				
Э4	Интернет Университет Информационных Технологий: http://www.intuit.ru/						
Э5	Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю: https://iprbookshop.ru/						
Э6	Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю: https://www.e.lanbook.com						
Э7	Электронная библиотека РГРТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: из корпоративной сети РГРТУ – по паролю: http://elib.rsreu.ru/						
	•	ень программного обеспечения и информационных справочно нзионного и свободно распространяемого программного обесп отечественного производства		ісле			
	Наименование Описание						
Операц	ционная система MS DOS	Бессрочно. Корпоративная лицензия Microsoft Im 700565239	Бессрочно. Корпоративная лицензия Microsoft Imagine Membership ID 700565239				
Kaspers	sky Endpoint Security	Коммерческая лицензия	Коммерческая лицензия				
LibreOt	ffice	Свободное ПО	Свободное ПО				
NI Lab	View	Лицензия для образовательных учреждений	Лицензия для образовательных учреждений				
		6.3.2 Перечень информационных справочных систем					
6.3.2.	1 Система Консультант	Плюс http://www.consultant.ru					

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
1	51 учебно-административный корпус. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы 30 мест, мультимедиа проектор benQ Pb 6200, доска магнитно-маркерная, компьютер, экран настенный			
2	57 учебно-административный корпус. Учебная лаборатория  для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, лабораторных работ текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная лабораторным оборудованием 20 мест, мультимедиа проектор Aser X128H, доска магнитно-маркерная, компьютер, 8 лабораторных столов, 3 компьютера ,блоки питания ВИП-009 (7 шт.), ВИП-010(4 шт.),вольтметры В7-21(4 шт.), В7-21A(3 шт.), Ф283, генераторы Г4-165, Г4-81, Г6-27, измеритель Л2-56, лазер ЛГИ-502, осциллографы С1-65, С1-76			
3	343 учебно-административный корпус. Учебно-вспомогательная Аудитория для хранения и ремонта оборудования 2 компьютера, принтер, сканер, 5 мест			

### 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Методические указания по дисциплине "Интеллектуальные датчики"").

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРЫ

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Литвинов Владимир Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ

19.09.25 17:51 (MSK)

Простая подпись

ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ **ВЫПУСКАЮЩЕЙ** КАФЕДРЫ

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Литвинов Владимир Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ

19.09.25 17:52 (MSK)

Простая подпись